

服務項目：

- 一般服務：
 1. 表面質譜：全質譜掃描分析表面成分
 2. 離子影像：分析特定元素在表面的分佈情況
 3. 縱深分析：分析特定元素在縱向深度的分布情況
- 特定服務：
 1. 大區域分析、縱向深度超過 2 μ m、三維分佈、
 2. 單件樣品分析時間超過 1 小時者

申請服務辦法：

Step1 請登入[國科會貴重儀器資訊管理系統](#)預約

貴儀中心：國立清華大學貴重儀器使用中心

主項儀器：MS-二次離子質譜儀(SIMS)

細項儀器：O₂、Cs 任選

Step 2 送樣

樣品製備好後，連同申請表送達本中心，經審查符合規格後，依序給予服務。如為特殊服務或樣品具有時效性，請先與操作員聯繫，以便安排時間處理。申請表上所列各項資料務請詳實填寫，如資料不全，將予退回，待補全再重新依序服務；若因資料不實，導致意外或儀器受損者，將視情節輕重，提出賠償要求或暫停使用人之申請權。

樣品準備須知：

- 使用者需自行處理樣品以符合規格。
- 樣品需為固體、表面積 0.5 × 0.5 ~ 1.0 × 1.0 cm²，厚度小於 0.3 cm；
- 不得具有永磁性、爆炸性、易燃性、腐蝕性、輻射性、毒性和揮發性。
- 每一樣品需分別裝在樣品盒中，盒外註明樣品名稱或編號。

Step 3 回件(預期回件時間)

- 數據檔案可選擇 E-mail 或磁片傳回(磁片請自行提供)
- 正常情形約 3 星期可拿回測試結果，
- 但若送件數過多或為特殊服務，時間酌為延後。

參考資料

1. 二次離子質譜儀，凌永健，科儀新知 1989, 11(2), 36-48.
2. 離子束質譜術的原理與應用，凌永健，科儀新知 1990, 12(2), 20-37.
3. 二次離子質譜儀在微電子工業上的應用，張梁興、凌永健，電子發展月刊 1990, 149, 50-59.